

光計測シンポジウム2013

- 日 程：9月27日(金)
- 時 間：9:30 - 17:00
- 会 場：東京ビッグサイト 会議棟 6F 608
- 主 催：日本光学測定機工業会
- 参加費：5,000円(論文集込)一般
4,000円(論文集込)正会員会社
- お申 込 方 法：「測定計測展」WEB(www.mt-expo.jp)からお申込ください。
※お申込み多数の場合は途中で募集を打ち切ることがあります。
- お問 合 せ 先：日本光学測定機工業会「光計測シンポジウム」事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8
TEL・FAX. 03-3435-8083 E-mail. info@j-oma.jp

プログラム

時間	講演題目/発表者(※登壇者)
	【挨拶】 圓谷 寛夫 ((株)ニコン)
	【座長】 椎名 達雄 (千葉大学)
9:30~9:50	表面性状計測のための走査型白色干渉計の新展開 (キヤノンマーケティングジャパン(株)) *佐藤 慶一
9:50~10:10	Bruker社製ContourGTシリーズ白色干渉型光学顕微鏡の最新動向 (ブルカー・エイエックスエス(株)) *古嶋 康志
10:10~10:30	「ハイブリッド微細形状測定機」～表面性状計測の可能性を無限にする接触・非接触の融合～ (株)小坂研究所 *本田 裕、金坂 辰美
10:30~10:50	光学式の表面性状測定機を対象としたFDTD法による基本形状に対する応答解析 (オリンパス(株)) *藤井章弘、林真市、藤井信太郎
10:50~11:00	休 憩
	【座長】 有賀 亨 (キヤノン(株))
11:00~11:20	産業用ポータブルOCT スキャナーの多機能化 (千葉大学) *椎名 達雄
11:20~11:40	正弦波位相変調干渉法による2次元複屈折測定 (新潟大学) *佐々木 修己、関沢 将司、崔 森悦、鈴木 孝昌
11:40~12:00	縞パターンによる半透明体の濁度測定法 (木更津工業高等専門学校) *小田功、宇山健太 (北海道工業技術センター) *菅原智明、吉岡武也
12:00~12:20	シュリーレン法による可視化のニーズ (株)溝尻光学工業所 *溝尻 旬
12:20~13:10	屋 休 憩
13:10~13:40	【特別講演】 新概念のテラヘルツ顕微鏡—サンプル自身の発光をナノスケールで観る— (東京大学) 梶原 優介
	【座長】 佐々木 修己 (新潟大学)
13:40~14:00	隣接したパルス列繰返し長を用いた長さ計測 —新たな物差しを求めて— (長岡技術科学大学) *韋 冬、高増 潔、松本 弘一
14:00~14:20	よう素安定化532nm DPSS小型レーザ光源 (株)ミツトヨ つくば研究所 *高橋 知隆、大関 衡和、増田 裕樹、宮田 薫、松浦 敏晋
14:20~14:40	2枚のスペックルパターンのみを用いた面外変形計測 ～空間的編解分析法による測定精度の向上～ (関西大学) *新井 泰彦、横関 俊介
14:40~15:00	ニコンにおける3D形状計測技術の紹介 (株)ニコン インストールメンツカンパニー *青木 洋
15:00~15:10	休 憩
	【座長】 藤本 洋久 (オリンパス(株))
15:10~15:30	非接触座標測定機のISO国際標準開発の動向と課題 (独)産業技術総合研究所 *阿部 誠、高辻 利之、佐藤 理、大澤 尊光
15:30~15:50	NEXIVの計測技術と共に、新シリーズの紹介 (株)ニコン インストールメンツカンパニー *長沼義広
15:50~16:10	可変焦点型リングビームを用いた同軸内面形状計測 (埼玉医科大学) *若山 俊隆、(NPO三次元工学会) 吉澤 徹
16:10~16:30	新概念トリリアンエンコーダ「FIBER SCALE」&「MICSYS」 (株)ミツトヨ *森 洋篤、黒岩 剛、川田 洋明、高橋 知隆、J.D.TOBIASON
16:30~16:50	軸受不要5自由度誤差運動一括測定装置の開発 (長岡技術科学大学) *明田川正人、ムハマドマティン、熊谷卓也、前田能孝 (中央精機(株)) *古閑重充、宗形 豊、寺尾功生
	【挨拶】 吉澤 徹 (NPO 三次元工学会)

※内容は予告なく変更される場合があります。

5展合同 特別企画

「下町ボブスレー」特別講演&展示



特別講演 日時：2013年9月25日(水) 13:30~14:30
会場：展示会場内 特設会場 ※聴講はWEBからお申込みください。

「下町ボブスレー」ネットワーク
プロジェクト推進委員会
委員長 細貝淳一氏
(株式会社マテリアル 代表取締役)

特別展示

「下町ボブスレー」ネットワークプロジェクト
推進委員会の協力による見本展示

日本からの
挑戦状。



会場アクセス

東京ビッグサイト www.bigsight.jp

〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1

- りんかい線 | 新木場駅(JR京葉線、東京メトロ有楽町線) →約5分→ 国際展示場駅[下車徒歩5分]
大崎駅(JR) →約13分→ 国際展示場駅[下車徒歩5分]
- ゆりかもめ | 新橋駅(JR、都営地下鉄浅草線、東京メトロ銀座線) →約22分→ 国際展示場正門駅[下車すぐ]
豊洲駅(東京メトロ有楽町線) →約8分→ 国際展示場正門駅[下車すぐ]
- 都 営 バ ス | 東16 東京駅八重洲口(JR、東京メトロ丸の内線) →約40分→ 東京ビッグサイト
海01 門前仲町駅(都営大江戸線、東京メトロ東西線) →約30分→ 東京ビッグサイト
- 空 港 バ ス (リムジンバス・京急バス) | 羽田空港 →約25分→ 東京ビッグサイト
成田空港 →約60分→ 東京ベイ有明ワシントンホテル[下車徒歩3分]
- 水 上 バ ス | 日の出橋(UR浜松町駅下車7分) →約25分→ 有明客船ターミナル[下船すぐ]
- 首都高速道路 | 台場・有明・臨海副都心・豊洲出口から5分



招待券

測定計測展

Measuring Technology Expo 2013

受付の際、名刺を2枚ご用意ください

本券で同時開催の「センサエキスポジャパン」「TEST総合試験機器展」「国際セラミックス総合展」「国際産業洗浄展」も入場できます

該当する項目に✓をつけてください。

A. あなたの業種は？

- 01. 官公庁・団体
- 02. 学校
- 03. 商社・流通
- 04. 電気・電子機器関連
- 05. 精密機器関連
- 06. 一般機械関連
- 07. 化学工業
- 08. 自動車関連
- 09. 研究関連
- 10. その他 ()

B. あなたの職種は？

- 11. 営業
- 12. 技術
- 13. 研究・開発
- 14. サービス
- 15. 企画
- 16. 学生
- 17. その他 ()

C. 本展を知ったのは？

- 21. 招待状
- 22. ポスター
- 23. 新聞・雑誌
- 24. インターネット・メール
- 25. メール
- 26. その他 ()

D. ご来場の目的は？ (複数選択可)

- 31. 機器購入・商談
- 32. 予算確保の資料入手
- 33. 最新の情報入手
- 34. 併催行事(シンポジウム、セミナー等)が行われているから
- 35. その他 ()

E. 本展以外の同時開催展で見学したいのは？ (複数選択可)

- 41. センサエキスポジャパン2013(併催：センサネットワーク技術展)
- 42. TEST2013[第12回総合試験機器展]
- 43. 国際セラミックス総合展2013
- 44. 2013地球環境保護 国際産業洗浄展

名刺を添付してください
(お忘れの際は、下記にご記入ください)

氏名 _____

勤務先名 _____

所在地 _____

〒 _____

所属部署名 _____

TEL _____

FAX _____

E-mail _____

個人情報のお取り扱いについて
ご登録いただいた個人情報は本展の運営管理、実施、次回開催等のご案内のために使用します。
各出展ブースへの訪問の際も、名刺を頂戴した場合は、当該出展者より、各種ご案内、情報等が行く場合もございますのでご承知いただけますようお願い申し上げます。主催者は、運営事務局メンバーおよび業務委託先が適切に個人情報を取り扱うよう監督し、個人情報の漏洩、滅失、毀損を防止いたします。

展示会事務局：フジサンケイ ビジネスアイ (日本工業新聞社) 営業・事業本部
〒100-8125 東京都千代田区大手町 1-7-2 TEL:03-3273-6180 FAX:03-3241-4999
E-mail:info@mt-expo.jp

MEASURING TECHNOLOGY EXPO 2013

グローバル時代のものづくり
“品質”にこだわる計測技術が集結!!

測定計測展

Measuring Technology Expo 2013

招待券

2013
9.25 WED ▶ 27 FRI
10:00 - 17:00
東京ビッグサイト 東ホール

同時開催：
センサエキスポジャパン2013 (併催：センサネットワーク技術展)
TEST2013 [第12回総合試験機器展]
国際セラミックス総合展2013
2013地球環境保護 国際産業洗浄展

ご来場者に
「光学・精密測定機器ガイド」を
無料で差し上げます!

主催：日本光学測定機工業会 日本精密測定機器工業会
特別協力：フジサンケイ ビジネスアイ

展示会事務局：フジサンケイ ビジネスアイ (日本工業新聞社) 営業・事業本部
〒100-8125 東京都千代田区大手町 1-7-2 TEL:03-3273-6180 FAX:03-3241-4999
E-mail:info@mt-expo.jp

www.mt-expo.jp

測定計測展

Measuring Technology Expo 2013

開催にあたって

日本光学測定機工業会と日本精密測定機器工業会は2013年9月、東京ビッグサイトにて測定をはじめとした計測全般に関する総合展示会「測定計測展2013 / Measuring Technology Expo 2013」を開催いたします。本展示会は毎年6月に開催されていた「光ナノテクフェア」を大幅にリニューアルし、フジサンケイビジネスアイの特別協力のもとに2011年に新たな情報交流の場として生まれ変わりました。奇数年秋に開催する新たなトレードショーとして、光学測定・精密測定はもちろん、幅広い計測業界の最新製品・技術・情報が一堂に集まり、関係者にとって見逃せない3日間となります。

また、同時開催展として「センサエキスポジャパン（併催：センサネットワーク技術展）」、「TEST / 総合試験機器展」、「国際セラミックス総合展」、「国際産業洗浄展」が同会場内で行われます。多数の出展者が集まりますので、関係各者・団体様には是非ご来場いただきたく、お願い申し上げます。

日本光学測定機工業会
日本精密測定機器工業会

日本光学測定機工業会

http://www.j-oma.jp/

光学測定機を製造販売しているメーカー団体です。ものづくりに必要不可欠な光学・測定・画像機器の健全な進歩発展により産業界に対し品質の安心・安全に貢献することを目指しています。

〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館204
TEL & FAX : 03-3435-8083

日本精密測定機器工業会

http://www.jpma.gr.jp

精密測定機器業界が結束し、情報の共有、技術の向上を図り、当該事業の健全な発展を通じて日本経済の繁栄に寄与することを目的としています。

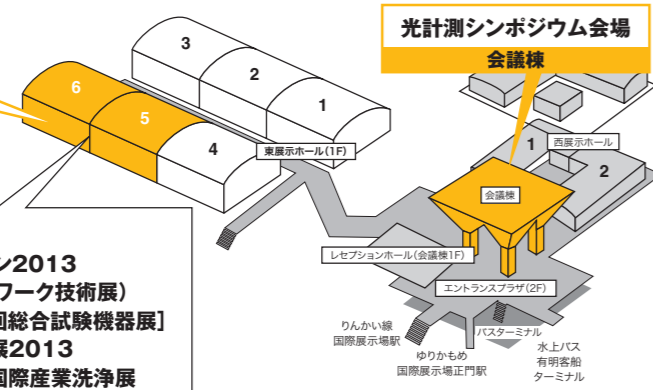
〒105-0003 東京都港区西新橋3-14-2 榎木ビル3F
TEL : 03-3434-9557 FAX : 03-3434-1695

開催概要

- 名称：測定計測展2013/Measuring Technology Expo 2013
(第47回全日本光学測定機展/第16回国際精密測定展)
- 会期：2013年9月25日(水)-27日(金) 10:00-17:00
- 会場：東京ビッグサイト 東ホール
- 入場料：無料(登録制)
- 主催：日本光学測定機工業会、日本精密測定機器工業会
- 特別協力：フジサンケイ ビジネスアイ
- 後援：経済産業省、(公社)応用物理学会、(公社)日本化学会
- 協賛：(公社)精密工学会、日本光学会、(一社)日本工作機械工業会、日本精密機械工業会、日本工作機械販売協会
- 併催企画：光計測シンポジウム、実務応用セミナー、技術相談コーナー、新技術発表コーナー

測定計測展
Measuring Technology Expo 2013
・実務応用セミナー
・技術相談コーナー
・新技術発表コーナー
東5・6ホール

(同時開催)
センサエキスポジャパン2013
(併催：センサネットワーク技術展)
TEST2013 [第12回総合試験機器展]
国際セラミックス総合展2013
2013地球環境保護 国際産業洗浄展



最新情報はホームページ www.nt-expo.jp

グローバル時代のものづくり “品質” にこだわる計測技術が集結!!

出展内容

測定・計測および光学・レーザーに関連する製品・技術・サービス・情報など

- 【出展製品例】
- ①変位・長さ： 寸法・距離(ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、投影機、測定顕微鏡、段差・厚さ測定機、顕微干涉計、膜厚計、光走査外寸測定機、レーザー干渉測長計、電気マイクロメータ、空気マイクロメータ) 位置・座標(2・2.5・3次元座標測定機、画像測定機) 平面・立体形状(真円度測定機、平面度・球面度測定機、断面形状測定機) 表面粗さ測定機
 - ②測定基準器： ゲージブロック、ゲージ(ねじゲージ、テーパゲージ、ピンゲージ、隙間ゲージ)、精密定盤、精密水準器
 - ③角 度： オートコロメータ、角度測定機
 - ④熱・光・電磁放射： 温度計、測光・測色・分光計(照度・放射照度、輝度・放射輝度、光束・放射強度、色彩・色温度)
 - ⑤光学特性： 屈折率、偏光、干渉
 - ⑥その他の物理量： 歪・応力・欠陥
 - ⑦観 察： 金属顕微鏡、実体顕微鏡、その他の顕微鏡、その他の観察機器
 - ⑧作業用機器： 芯出し顕微鏡、望遠鏡、加工用機器
 - ⑨専用機器： 歯車測定機、ねじ測定機、偏心検査器、真直度測定機、自動寸装置、自動選別機
 - ⑩実験機器、支援機器
 - ⑪部品・ユニット： スケールユニット、測長ユニット、変位測定ユニット、ロータリーエンコーダ、メカニカルユニット、座標データ処理機器、TV関連機器、画像関連機器、光源関連機器、光学ユニット、光学部品
 - ⑫その他

出展者のみどころ

(7月12日現在)

(株)アイゼン 長寿命 超硬ねじプラグゲージ	黒田精工(株) ゲージ技術で培った精密技術で産業界に貢献。ゲージメーカーならではの品揃え	(株)デジタルマイクロシステムズ リアルタイムでサンプルの3D画像をサブナノメートル分解能で表示します	ハール光学工業(株) / フォトリソグラフィ(株) / (有)モノリチウムジャパン ワイド測定レンジとナノレベル分解能を両立した形状測定機を提案します。	(株)ユーロテクノ アリコナ社製 / 全焦点3D表面形状測定装置。急斜面や粗さ測定にも対応。
itp(株) 高精度・低価格なドイツitp製の精密測定機用スタイラスと関連パーツ	(株)小坂研究所 測定機の精度追求と併せて、次の時代に向けた測定機を出展予定です。	土井精密ラップ(株) エアードと真空を併用した全く新しいスライダ。耐久性向上したゲージスタンド	(株)フジキカイ 異物検査装置及び当社のメイン機種である、横形ピロー包装機を出品致します。	ランド・テクノロジーズ・ジャパン(株) IX、PASSCMMなど品質、検査に関するソリューションを展示いたします
ドイツ・ekm Jena GbR 伝統の信頼性と革新の操作性を融合させた高精度万能測定機LMIシリーズ	(株)三啓 ミクロからマクロまでの測定・観察のお手伝いを致します。	(株)東京精密 お客様にとって「Only One」の計測をトータルでご提案致します。	ブルカー・エイエックスエス(株) 最新型3次元光干渉型光学顕微鏡を実機展示デモを行います。	(株)菱光社 非接触三次元測定器、測長システム等のソリューションをご提案します。
(株)SPIエンジニアリング 内視鏡直径2.9mmの超極細工業用内視鏡を出展。	(株)システムズエンジニアリング LED、Lamp照明のnear/far field配光測定装置及び全光束測定装置関連機器	(株)トプコン / (株)トプコンテクノハウス LED・有機EL照明の演色評価数を手軽に測定。演色照度計IM-1000!!	ポリウムグラフィックス(株) CTデータを利用した内部形状を含む座標計測と解析ソフトウェア	レニショー(株) 生産性を高める先進の測定ソリューションを提案します。
岡本硝子(株) レーザー測定に役立つ高性能ビームスプリッターなどを展示いたします。	(株)測範社 ねじゲージ、テーパゲージ、限界ゲージ、マスターリングゲージ、セラリング	トライオプティクス・ジャパン(株) 偏芯・中心厚・面間隔・MTF・EFLなど各種光学測定装置を展示実演します	丸文(株) 非接触式ひずみ分布解析装置(レーザー不要)をご紹介します。	YKT(株)・OGP 測定計測機械の他形状比較や幾何公差ソフト等様々なソリューションをご提案します。
(株)尾崎製作所 用途別精密測定機器にて特徴ある製品をご紹介します。	ソーラトロンメトロロジー / 八洲貿易(株) 精密測定用ゲージングプローブ、レーザーセンサー、計測システムを出展。	(株)ニコン / (株)ニコンインステック 2D/3Dの精密光学測定をはじめ、多彩な観察手法を、ご提案します。	丸紅情報システムズ(株) 3次元形状測定「ATOS」 / 3次元動的変位変形測定「ARAMIS」	
(株)オプトロニクス社 月刊オプトロニクス最新号、光製品バイヤーズガイド、OPIE2014、オプトキャリア	(株)第一測範製作所 多彩な測定機器と高度な精密加工技術で、お客様のための新たな用途を提案!	日本ゲージ(株) 国内外に多数納入実績のある自動計測装置、ユニット、及びバルンサーを展示	(株)溝尻光学工業所 微小な内部欠陥がくっきりと画像で見える新型シュリーレン装置登場!	
オリンパス(株) 新製品2機種(レーザー顕微鏡、ナノサチ顕微鏡)を実機展示いたします。	中央精機(株) 従来品の精度、使い易さを更に追求した新製品を中心に展示いたします。	(株)ノビテック 【実演】計測対象の動きをリアルタイムに数値化するシステムで3次元計測 VENU3D	(株)ミツトヨ 精密測定を通じてお客様の事業発展に貢献いたします。	
カールツァイス(株) カールツァイスのマルチセンサ測定機O-INSPECTを紹介いたします。	(株)テックロック ダイヤルゲージからゴム硬さ計まで、長さ・硬さの幅広いニーズに対応致します。	(株)バルメソ 硬さ・スクラッチ試験・摩耗試験ではない「MSE試験	ユニオンツール(株) 接触式外径測定器DS-2000: 分解能0.01μmを実現した新製品です。	

併催行事

【参加無料】 【会場：展示会場内】

実務応用セミナー	【登録不要(会場まで直接お越しください)】	(敬称略)
9月26日(木) 13:00-13:45	レニショー株式会社 三次元測定機に大きな変革をもたらす5軸制御プローブヘッド 講演者：片平 智哉	
14:00-14:45	中央精機株式会社 回転運動体の不要5自由度誤差運動の一括同時測定 講演者：技術部 清水 豊ほか	
15:00-15:45	株式会社ミツトヨ マイクロメータの進化の歴史 講演者：広島商品設計部 係長 藤川 勇二、営業技術部 営業技術1課 主査 渡辺 昌弘	
9月27日(金) 11:00-12:30	YKT株式会社 生産工程を激変させる3次元“幾何公差”評価ソフトウェア 3次元形状解析ソフトウェアを用いた実測値による製造工程の支援 講演者：Mr.Kostadin Doytchinov (QVIグループ、Kotem社) 英語・通訳付	
13:00-13:45	株式会社第一測範製作所 空気マイクロメータによる寸法形状測定の基礎と応用 講演者：営業部 部長 桑原 和寿	
14:00-14:45	株式会社ミツトヨ 最新の測定顕微鏡 講演者：広島商品設計部 大森 豊博、営業技術部 営業技術2課 甲斐 圭亮	
15:00-15:45	株式会社ミツトヨ 三次元マルチプローブのご紹介 講演者：営業技術部 営業技術1課 松原 太郎	

新技術発表コーナー

千葉大学大学院融合科学研究科 情報科学専攻 推名研究室	超小型ライダーによる大気/ガス/粉塵の可視化/検知および産業用ポータブルOCTスキャナーによる基礎医療診断/産業製品評価
NPO三次元工学会 / 埼玉医科大学	内面形状計測技術とその応用
木更津工業高等専門学校 / 北海道立工業技術センター	食品の鮮度評価に最適な濁度の測定法
独立行政法人 産業技術総合研究所	高機能ロータリーエンコーダSelfA+の自己校正機能・軸ぶれ検出機能
宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 大谷研究室	偏光を用いた微細形状測定や物性測定とパターン投影三次元形状測定 ほか

技術相談コーナー

近年、成形加工技術などの高度化に伴い加工物が複雑になると共に測定機も多様化しており、専門技術者でも困る場合があります。当展示会では、会場内に専門技術者による技術相談コーナーを開設し、ご相談を秘密厳守でお受けしております。お気軽にご利用ください。

同時開催展

下記関連展示会との同時開催により、関連応用分野から多数の来場者が訪れます。(間仕切りを設けない相互入場制)

センサエキスポジャパン2013(併催：センサネットワーク技術展)

主催：フジサンケイビジネスアイ
特別協賛：次世代センサ協議会
センサとその応用技術、機器、システム、ネットワークに関する専門展示会
展示内容：センサ、MEMS、計測器やその応用技術、システム、ソリューション、情報など

TEST2013 [第12回総合試験機器展]

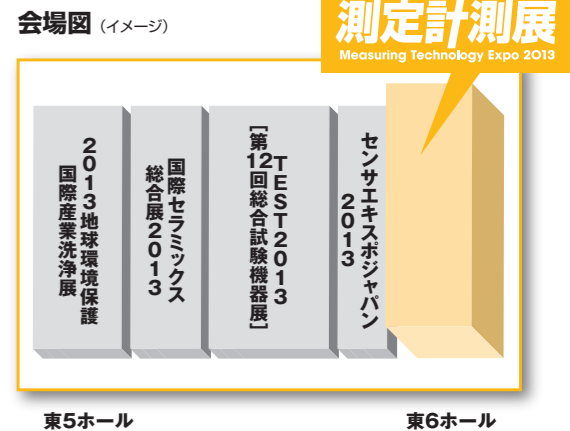
主催：日本試験機工業会
材料試験&環境試験と計測、評価に関する国内唯一の総合展
展示内容：展示内容：試験機、装置、システム、計測器、解析サービス、情報など

国際セラミックス総合展2013

主催：社団法人日本セラミックス協会、財団法人フインセラミックスセンター、社団法人日本フインセラミックス協会、フジサンケイ ビジネスアイ
セラミックスの最先端技術が集まるわが国唯一の展示会
展示内容：セラミックス製品、応用製品・装置・技術・材料、ソリューション、情報など

2013地球環境保護 国際産業洗浄展 初回同時開催

主催：日本産業洗浄協議会、一般社団法人日本産業機械工業会、フジサンケイ ビジネスアイ
洗浄機器、洗浄剤などの産業洗浄の世界最先端技術が集まる展示会
展示内容：洗浄機・システム、洗浄剤、回収装置、周辺機器、VOC排出抑制関連、情報など



測定計測展

Measuring Technology Expo 2013

東5ホール

東6ホール